

高分解能走査型プローブ顕微鏡

【Bruker株式会社 Dimension ICON】

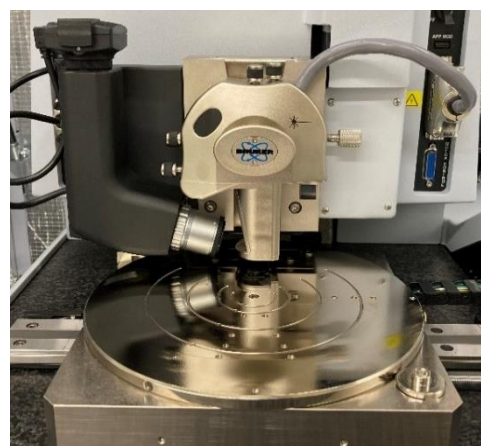
【設備の特徴】

・微小探針先端原子と試料表面原子の間に働く原子間力を利用して原子構造レベルの試料表面形状の評価が可能な装置です。また、走査探針を変更することによって弾性率マッピングや、磁気力(MFM)像、電気力(EFM)像などを得ることができます。

【設備の仕様概要、技術内容】

■仕様概要

X-Y Scan range	90 × 90μm
X-Y position noise	≤0.15nm RMS
Z range	10μm
Z sensor noise level	35pm RMS
Sample size	φ 300mm × t 15mm



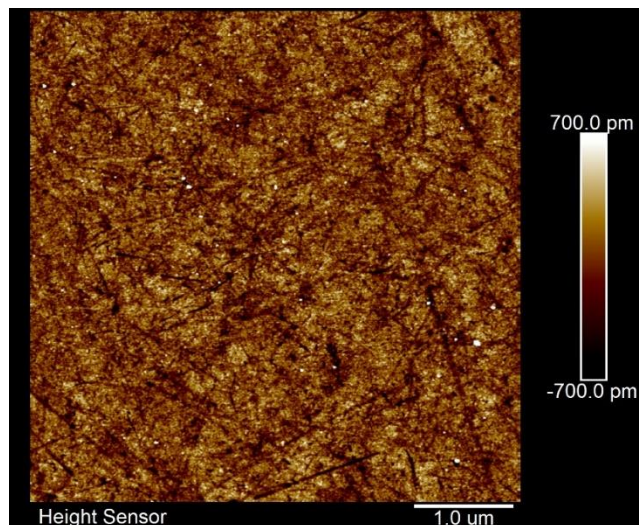
■効果が期待される利用分野

【活用例】

- ・超鏡面研磨品の表面粗さ測定
- ・液中DNAプローブの可視化
- ・磁気記録パターンの可視化

【適用製品の例】

- ・光学部品
- ・半導体基板
- ・電子部品
- ・医療検査キット
- ・磁気記録装置



試料提供：エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社 秋田工場様

【お問い合わせ先】

秋田県産業技術センター

先進プロセス開発部 システム制御グループ 久住 孝幸

TEL: 018-862-3414 / FAX: 018-865-3949

E-Mail: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11 / <https://www.aitc.pref.akita.jp/>